科学研究費補助金研究成果報告書

平成21年 5月28日現在

研究種目:若手研究(B) 研究期間:2007~2008 課題番号:19760007

研究課題名(和文) 半導体量子構造における対称性の操作と光物性の制御

研究課題名 (英文) Control of crystal symmetry and optical properties in semiconductor

quantum structure

研究代表者

山下 兼一 (YAMASHITA KENICHI)

京都工芸繊維大学・工芸科学研究科・助教

研究者番号:00346115

研究成果の概要:本研究では、結晶構造の対称性操作により半導体の光学物性が制御できることを示すために、量子構造を形成した半導体発光材料の光学的異方性を評価した。偏光フォトリフレクタンスの測定結果より、電子エネルギー帯構造の結晶面方位異方性と光学遷移強度の相関を明らかにした。特に、高次のエネルギー遷移を含んだ広いスペクトル領域での光学遷移異方性を初めて実験的に示し、理論から予測されていた基礎物性と比較、検討した。

交付額

(金額単位:円)

	直接経費	間接経費	合 計
2007年度	2, 100, 000	0	2, 100, 000
2008年度	1, 200, 000	360, 000	1, 560, 000
年度			
年度			
年度			
総計	3, 300, 000	360, 000	3, 660, 000

研究分野:応用物性・結晶工学・電子電気材料工学

科研費の分科・細目:応用物理学・工学基礎 ・ 応用物性・結晶工学

キーワード:(1) 結晶工学 (2) 電子・電気材料 (3) 半導体物性 (4) 光物性

(5) 量子井戸

1. 研究開始当初の背景

現在のエレクトロニクス産業あるいはオプトエレクトロニクス産業を支えている半導体材料は、次世代の各種デバイス・機器の創製のためにも根幹となると考えられ、高い機能性あるいは新しい機能性を発現させるためにその電子的・光学的性質を自在に制御する技術を確立することが今後も重要な課題である。この目標に向けて、材料混晶比の調整やナノ構造作製による量子効果などの導入とともに、半導体材料自身あるいは作製する量子構造の結晶工学的な対称性操作も非常に重要な手段になり得る。例えば閃亜鉛

鉱型半導体結晶の1次元量子井戸構造をベースとして考えると、自発的な原子の周期構造である自然超格子構造や、量子井戸構造の成長方向として面内での原子配列に異方性が伴う[110]方向を取った[110]面量子井戸などは比較的導入しやすい対称性の操作であり、通常のバルク結晶あるいは[001]面量子井戸構造とはそれぞれ全く異なった電子・大学的性質が得られる。また、学術上・実用上の両面で非常に興味深い現象が発現することも示されている。これらの例を、次世代の電子状態が自在に制御された高機能半導体材料・デバイス実現のための一つのア

プローチ手段として発展させるために、構造の対称性と電子的・光学的基礎物性に対する 学術的理解を深めておくことは特に重要な 課題であると言える。

2. 研究の目的

本研究は、材料が元来持っている結晶対称性の操作により、半導体量子構造の電子状態及び光物性を制御し、既存デバイスの高機能化と次世代の量子デバイス創製のための知見を探索することを目的とする。 閃亜鉛鉱構造の[001]方向のような化合物半導体でよく用いられる対称性の高い材料系では得難い新しい機能性の発現を目指した本研究の実施により、対称性というパラメータの積極的導入による新たな概念での新規物質あるいはデバイスデザインに関する研究が加速されるものと期待できる。

本研究では、以下の2つを研究対象として、ナノスケールでの原子配列に起因する対称性の低下を伴った半導体量子構造の基礎物性を光学的な実験手法により明らかにする。

- (1) GaInP 系混晶半導体における自然超格子 構造形成によるヘテロ界面電子状態変 化
- (2) (110) 面量子井戸構造における面内光学 異方性の評価

(1)で取り上げている半導体自然超格子構 造とは、エピタキシャル成長過程で自発的に 現れる対称性の低下(空間群:F-43m→R3m) を伴った長距離秩序構造のことであり、この 対称性低下によりバルクとは全く異なった バンド構造を形成することや、大きな分極効 果が発現することが知られている。申請者は これまでに、その電子状態と光物性について 実験・理論計算両面から詳細に研究を行って きた。例えば、ラマン散乱や磁気光学測定を 用いた評価により、意図的なドーピングを施 さずとも分極効果の影響により界面に良好 な2次元電子ガスが発生することが明らかに されている。本研究期間では、実験結果を系 統的に理解するために理論計算を用いた検 討を行い、対称性の変化による分極効果の発 生度合いを解析することを試みる。一方、(2) で取り上げている(110)面量子井戸構造はそ の対称性が2軸性となり、量子井戸面内での 異方的な原子配列が光学特性に反映され、特 定の結晶軸方向で遷移確率が増大するなど の現象が発現する。本研究期間内では、 InAlAs/InGaAs (110) 面量子井戸などを材料 として、特に光学遷移確率の偏光依存性とい う観点から、電子状態と光学特性の変化を井 戸幅の関数として詳細に調べ上げる。

3. 研究の方法

(1) 自然超格子構造形成による分極効果の 理論解析 GaInP 系混晶半導体における半導体自然超格子形成による GaAs とのヘテロ界面電子状態の変化について、まだ未解明であるピエゾ電界および自発分極効果の発生と周期構造の形成度合いの因果関係を明らかにもとりに、数値計算による理論解析を行う。原対ので発生する理論解析を行う。相関係を明らかにし、図1に示すような界面三次で発生することがで発生することがで発生する。これらの結果より、界面三次で電子ガス濃度を定量的に決定するパラメータを導き出し、新しい機能を持った量子構造創製へ向けた検討を行う。

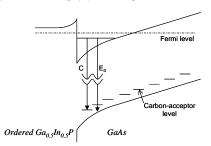


図 1 自然超格子 Ga InP/GaAs ヘテロ接合のバンドア ライメント

(2) (110) 面量子井戸構造における遷移 強度の定量的評価

(110) 面量子井戸においては、対称性の低下に伴ってブリリュアンゾーン中心でもヘビーホール・ライトホールバンドがミキシングした複雑な電子状態を構成しており、面内での光学異方性を示す。また、スピン軌道分離準位とのミキシングにより、その異方性は井戸幅の関数として変化することが理論計算より予測されている。そこで本研究では、これらの実験的検証を行うために、(110) InP基板上に成長した InGaAs/InAlAs 及びInGaAs/InP量子井戸構造の面内光学異方性を変調反射スペクトル測定により探索する。井戸幅の異なるサンプルについて系統的な実験を行い、光学遷移強度の変化を定量的に明らかにする。

4. 研究成果

まず、GaInP自然超格子の発生による分極効果の理論解析についての研究成果を述べる。図 2 は、自然超格子構造を有するGaInP/GaAsのラマン散乱スペクトルであり、GaAs光学フォノンモードの波数近辺を示している。 η は自然超格子構造の形成度合いを表すものであり、オーダーパラメターと呼ばれる。 η =0 の場合は $295 cm^{-1}$ 付近のGaAs-L0フォノンモードによるシャープな散乱ピークのみが観測されるのに対して、 η \neq 0 の場合は は大きな偏光異方性を有するブロードなピークが 260- $270 cm^{-1}$ 近傍に現れる。これは界面での電荷蓄積に由来したプラズモンーフォノン結合モードであり、その波数より 3 次元

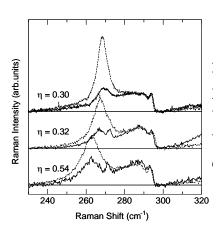


図 2 自然超格子 GaInP/GaAs のラマン散乱スペクト ル

電荷密度を見積もることができる。その結果、蓄積電荷密度はオーダーパラメターの増加とともに減少する傾向があり、分極効果の発生度合いに応じて2次元電子濃度が増加すると示している過去の文献によるC-V測定の結果とは異なることがわかった[図3(b)"×"プロット参照]。

ラマン散乱及びC-V測定の結果の違いを考察するために、有限要素法とトランスファーマトリックス法を用いて、GaInP/GaAsへテロ界面のバンド構造及び電子の波動関数分布を自己無撞着的に計算した。図3(a)に示すように、伝導帯不連続エネルギーと GaAs 層での界面電界をオーダーパラメターに依存する物理量として(それぞれ第一原理計算結果とフォトルミネッセンス励起スペクトル測定により定量化されている)計算を行った。図4に、計算によって得られたヘテロ界面近

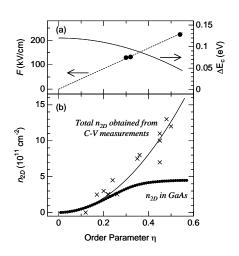


図3 (a) 界面電界及び伝導帯不連続のオーダーパラメター依存性 (b) CV 測定及び理論解析により得られた界面2次元電子ガス濃度のオーダーパラメター依存性

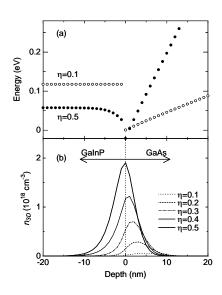


図4 理論計算により得られた(a) 界面近傍におけるバンド構造と(b) 2次元電子の波動関数分布

傍における(a)バンド構造と(b)電子の波動関数の空間分布を示す。オーダーパラメタ布の増加に従い、2次元電子ガスの空間分布とが元電子ガスの空間分析し、GaInP層に大きくしみだしていることが分ラーとともに小さくなりで表したである。子の結果、GaAs側の界面近傍に存在するでである。子が知制されるものと思われる。これは、ラマン散が加きれるものと思われる。この書籍、GaAs側の界面近傍に対力ス濃度は小さくなり、図3(b)の黒東度は小さくなり、図3(b)の黒東度は小さくなり、図3(b)の黒東度は小さくなり、図3(b)の黒東度は小さくなり、図3(b)の黒東度は小さくなり、図3(b)の黒東度は小さくなり、図3(b)の黒東で示すように、2次元電子ガッカス濃度は小さくなりの黒東東で表している。

次に、(110)面量子井戸構造における面内 光学異方性の評価結果について述べる。図5 は InP(110) 基板上に成長した InGaAs/InAlAs 多重量子井戸 (MQW) の偏光フォトリフレク タンススペクトルである。(a)及び(b)はそれ ぞれ井戸幅 8nm、5nm のサンプル、(c)は InP(001) 基板上に作製したサンプルについ ての結果である。それぞれのスペクトルにお いて、基礎吸収端から高次のエネルギー遷移 までの遷移信号が観測されている。また、 (001) 基板の MQW では偏光依存性が見られな いのに対して、(110)基板の MQW では、それ ぞれの遷移信号が異なった偏光依存性を示 していることがわかる。この MQW サンプルに 対しては、過去に偏光フォトルミネッセンス 励起スペクトル測定において基礎吸収端の 光学遷移異方性が議論されていた。今回、偏 光フォトリフレクタンス法を導入すること により、高次のエネルギー準位が関与した異 方的遷移信号の観測に初めて成功した。

フィッティングにより、観測されたスペク

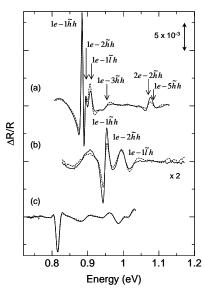


図5 InGaAs/InAlAs 多重量子井戸構造の偏光フォトリフレクタンススペクトル

トルは各遷移信号に分割することができ、そ れぞれの遷移強度の異方性を定量的に評価 することができる。図5(a)の井戸幅 8nm の サンプルを例に取ると、1e-1hh と 1e-1lh の 偏光異方性は逆であることが分かる。また、 これらの遷移の偏光度は井戸幅の低下とと もに増大していることが分かる。一連のスペ クトル解析により得られた全ての遷移信号 に対する偏光度を図6(b)にプロットしてい る。この実験結果を考察するために、スピン 軌道分離バンドを考慮した 6 x 6 Luttinger-Kohn ハミルトニアンによる価電 子状態の理論計算を行った。図6(b)中の実 線及び破線により理論計算結果を示す。 1e-1hh、及び 1e-1lh の遷移に関しては、無 限大ポテンシャルを仮定しているために僅

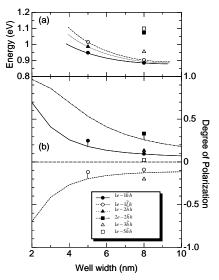


図 6 InGaAs/InAIAs 多重量子井戸構造の(a) 遷移エネルギー及び(b) 偏光度の井戸幅依存性

かな相違はあるが、概ね理論どおりの結果が 得られていることが分かる。2e-2hh 遷移偏光 度は、1e-1hh よりもかなり大きい。これは、 ホールの量子化エネルギーが大きいため、ス ピン軌道分離バンドとの相互作用が強いこ とに起因しており、エネルギー準位の高次化 は井戸幅の低下と等価であることを意味す るものである。一方、1e-2hh や 1e-3hh とい った遷移信号については、電子及びホール波 動関数の直交性のために本来は禁制であり、 無限大ポテンシャルを仮定したハミルトニ アンでは解析することができない。言い換え ると、これらの遷移の振動子強度異方性には、 バリア層である InAlAs の Luttinger パラメ ターが大きく影響することを示す。過去の文 献では、Kane のハミルトニアンにより 1e-2hh や 1e-3hh といった遷移信号についても偏光 度の理論計算が行われており、今回の実験結 果と定性的な一致を示している。

5. 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計1件)

① <u>K. Yamashita</u>, H. Asai, and K. Oe, "Anisotropic optical transitions in [110]-oriented semiconductor quantum well studied by photoreflectance spectroscopy", Japanese Journal of Applied Physics, Vol. 46, pp. 1536-1539, (2007), 查読有

〔学会発表〕(計1件)

- ① <u>K. Yamashita</u>, et al., "Experimental Investigation of Anisotropic Optical Transition Matrix Elements in [110]-Oriented InGaAs/InAlAs Quantum Well", 34th International Symposium on Compound Semiconductors, 2007/10/15, Kyoto
- 6. 研究組織
- (1)研究代表者

山下 兼一 (YAMASHITA KENICHI) 京都工芸繊維大学・工芸科学研究科・助教 研究者番号:00346115

(2)研究分担者

()

研究者番号:

(3)連携研究者

()

研究者番号: